Search Notes

Appl	icat	ion/(Contro	l No.
------	------	-------	--------	-------

10/739,224 Examiner

Kelly L. Jerabek

Applicant(s)/Patent under Reexamination

TAKESHITA, TETSUYA Art Unit

2622

	SEAR	CHED	
	JLAN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Class	Subclass	Date	Examiner
348	223.1	2/9/2007	KJ
	225.1		
	227.1		
	229.1		
	,		

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner

•	DATE	EXMR
IEEE .	2/9/2007	KJ
EAST Keyword	2/9/2007	